

# Información Logística

- Del 2 al 6 de Marzo de 2015.
- Dirección: Universidad Autónoma de Barcelona, Facultad de Ciencias, Servicio de Microscopía, Campus de Bellaterra - 08193 Bellaterra (Barcelona).
- Nº de días: 5
- Las sesiones prácticas incluyen trabajar con microscopía confocal e interferométrica Leica DCM.
- Valor de la inscripción: 600 Euros.
- Dicho pago incluye documentación, material de prácticas, comidas, coffee breaks y la cena del curso.
- Los interesados deberán solicitar reserva de plaza rellenando el formulario de pre-inscripción on-line en la web <http://sm.uab.es>. Para cualquier consulta, podrán dirigirse por fax o email a:  
Servicio de Microscopía de la UAB  
Atención: Esperanza Ramírez  
Tel.: 93 581 15 16  
Fax: 93 581 20 90  
E-mail: [s.microscopia@uab.es](mailto:s.microscopia@uab.es)
- Dado que el número de plazas está limitado a 12 personas, éstas se reservarán por riguroso orden de inscripción. Cada persona recibirá acuse de recibo tras su inscripción. El pago se efectuará con anterioridad al 2 de febrero mediante transferencia bancaria.
- Alojamiento: caso de requerirlo, pueden efectuar reserva de hotel a través de la agencia de viajes de la Universidad Autónoma de Barcelona enviando un e-mail a [uab@viajeseci.es](mailto:uab@viajeseci.es) con la referencia "curso confocal Leica", pudiendo en este caso acogerse a las tarifas universitarias.

# Profesores

**Dionís Díez**, Leica Microsistemas S.L.  
**Óscar Rodríguez**, Leica Microsistemas S.L.  
**Mònica Roldán**, Servicio de Microscopía, UAB  
**Emma Rossinyol**, Servicio de Microscopía, UAB

# Conferenciantes

**Jordi Díaz**, Centres Científics i Tecnològics. UB  
**M<sup>a</sup> José Esplandiú**, Centro de Investigación en Nanociencia y Nanotecnología, CIN2 (ICN-CSIC)

# Colaboran

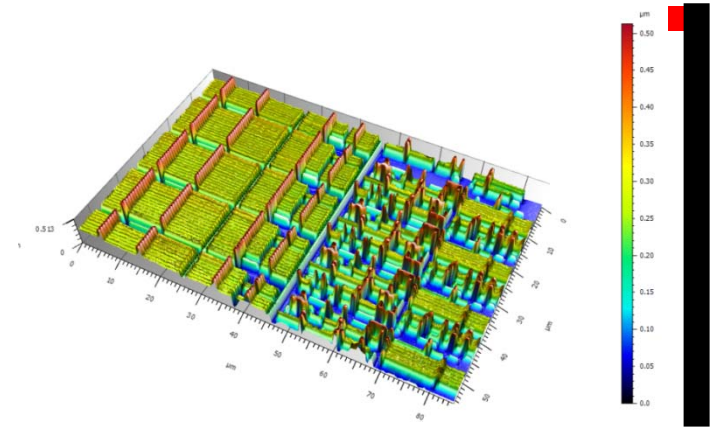
**Irati Golvano**, Servicio de Microscopía. UAB  
**Laura Olomi**, Leica Microsistemas S.L.  
**Esperanza Ramírez**, Servicio de Microscopía. UAB  
**Meritxell Vendrell**, Servicio de Microscopía. UAB

# Coordinadores del curso:

Óscar Rodríguez (Leica Microsistemas), Onofre Castell (UAB) y Mònica Roldán (UAB)

Leica Microsistemas, S.L.  
C/ Nicaragua, 46  
08029 Barcelona  
Tel. +34 93 494 95 55  
Fax +34 93 494 95 32

Servei de Microscòpia  
Campus de la UAB  
08193 Bellaterra (Barcelona)  
Tel. +34 93 581 15 16  
Fax +34 93 581 20 90



© Óscar Rodríguez (Leica Microsistemas S.L)

# I Curso de metrología superficial para usuarios de sistemas Leica DCM

Del 2 al 6 de Marzo de 2015

Centro de formación en microscopía confocal Leica.  
Servicio de Microscopía de la Universidad Autónoma de Barcelona



Living up to Life

**Leica**  
MICROSYSTEMS

## Información General

### Curso de metrología superficial (Sistemas Leica DCM)

#### Objetivos del Curso:

Es un curso de usuario de microscopía confocal de reflexión e interferométrica Leica DCM. Combina sesiones teóricas y prácticas en aras de proporcionar los conocimientos básicos necesarios para una adecuada utilización de dichas técnicas instrumentales y aplicadas al análisis metrológico superficial. Durante las sesiones de observación de muestras, los alumnos tendrán la posibilidad de analizar sus propias muestras.

#### ¿A quién está dirigido?

Este curso está destinado a todas aquellas personas que vayan a utilizar o estén utilizando un microscopio confocal e Interferométrico Leica DCM, y deseen adquirir/ampliar sus conocimientos teórico-prácticos sobre el mismo. Es recomendable que los participantes tengan unos conocimientos básicos de la microscopía óptica.

¿Quiénes constituyen el cuadro de profesores? Todos ellos utilizan la microscopía confocal e interferométrica tanto en sus áreas aplicativas como técnicas y están especializados en campos muy diversos.

## Lunes 2 de Marzo de 2015

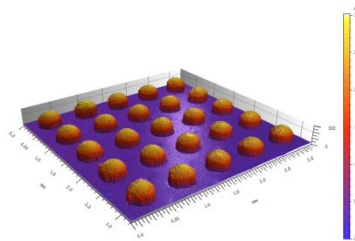
- 11:45 **Recogida de acreditaciones y documentación del curso**
- 12:00 **Bienvenida.** Mònica Roldán
- 12:30 **Fundamentos de la microscopía óptica.** Dionís Díez
- 14:00 Comida
- 15:00 **Microscopía Confocal y Leica DCM.** Óscar Rodríguez
- 16:00 Sesión práctica: **Fundamentos Ópticos.**  
Dionís Díez/Óscar Rodríguez
- 17:00 Fin de la sesión

## Martes 3 de Marzo de 2015

- 09:30 **Adquisición en Leica DCM.** Dionís Díez
- 10:30 Coffee Break
- 11:00 Sesión práctica: **Adquisición en Leica DCM.**  
Dionís Díez/Óscar Rodríguez
- 13:00 **Aplicaciones de la microscopía Confocal e Interferométrica.** Óscar Rodríguez
- 14:00 Comida
- 15:00 **Análisis de Rugosidad.** Dionís Díez
- 16:00 Sesión práctica: **Análisis de la Rugosidad.**  
Óscar Rodríguez/Dionís Díez
- 17:00 Fin de la sesión

## Miércoles 4 de Marzo de 2015

- 09:30 **Análisis en Leica DCM.** Óscar Rodríguez
- 10:30 Coffee Break
- 11:00 Sesión práctica: **Análisis en Leica DCM I.**  
Dionís Díez/Óscar Rodríguez
- 13:00 **Interferometría y Leica DCM.** Dionís Díez
- 14:00 Comida
- 15:00 Sesión práctica: **Interferometría.**  
Dionís Díez/Óscar Rodríguez
- 17:00 Fin de la sesión
- 21:00 Cena del curso



## Jueves 5 de Marzo de 2015

- 09:30 Conferencia: **“La microscopía confocal de fluorescencia aplicada al estudio de materiales”.** Mònica Roldán
- 10:30 Coffee Break
- 11:00 Sesión práctica: **Análisis en Leica DCM II.**  
Dionís Díez/Óscar Rodríguez
- 13:00 Conferencia: **“Aplicaciones de confocal DCM 3D en polímeros y pinturas”.** Emma Rossinyol
- 14:00 Comida
- 15:00 Sesión práctica: **Análisis de muestras de los participantes.**  
O. Rogríquez/D. Díez/E. Rossinyol/M. Roldán
- 17:00 Fin de la sesión

## Viernes 6 de Marzo de 2015

- 09:30 Sesión práctica: **Análisis en Leica DCM III.**  
Dionís Díez/Óscar Rodríguez
- 10:30 Coffee Break
- 11:00 Conferencia: **“Aplicaciones de la microscopía óptica avanzada en el campo de la odontología”.** Jordi Díez
- 11:30 Conferencia: **“Nanoactuadores impulsados por reacciones catalíticas”.** M<sup>a</sup> José Esplandiú
- 12:00 Conferencias sobre aplicaciones en la empresa privada
- 13:00 Mesa Redonda y Fin de Curso
- 14:00 Comida

